

日本信頼性学会
第36回秋季信頼性シンポジウム
プログラム

2023年10月27日現在 (敬称略)

対面とオンラインのハイブリッド開催 (日科技連東高円寺ビルとMicrosoft Teams)

日時: 2023年11月2日 (木) 10:30~17:25

10:30~10:35	開会挨拶 (日本信頼性学会副会長 宮地由芽子)
	セッション1【システムの信頼性、安全性、ライフサイクル、ソフトウェア面及び理論】司会: 岩田、補助: 遠藤
10:35~11:00	鉄道信号用電子機器の使用環境調査に基づく劣化ストレス主要因の選定 ○高崎 建、藤田 浩由(公益財団法人鉄道総合技術研究所)
11:00~11:25	複数カメラ画像を用いた3バージョン物体検出 システムの信頼性評価 ○高橋滯帆、町田文雄(筑波大学)
11:25~11:50	物理モデリングとその階層化に対応したSTAMP/STPAの活用手法の提案 ○市村純一 (放送大学/ニュートンワークス株式会社)
11:50~12:55	昼食休憩
12:55~13:00	会長挨拶 (日本信頼性学会会長 早川 有)
	特別講演 司会: 根本
13:00~14:30	X線分光撮像衛星 (XRISM) における信頼性向上の取り組み 前島 弘則 宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所X線分光撮像衛星 (XRISM) プロジェクトチーム
14:30~14:40	休憩
	招待講演 司会: 根本
14:40~15:30	様々な誘電体層における時間依存絶縁破壊の故障メカニズムに関する考察 門田 靖 株式会社リコー リコーテクノロジーセンター先端技術研究所IMD研究センター第4研究室 (日本信頼性学会 前会長)
15:30~15:40	休憩
	セッション2【試験、故障解析、部品、要素技術の信頼性、ハードウェア面】司会: 横川、補助: 根本
15:40~16:05	信頼性試験研究会活動報告 - 故障物理と信頼性試験条件 - ○松岡敏成、小東 彩(三菱電機)、藤田浩由(鉄道総合技術研究所)、石津勝之(村田製作所)、梅村知弘(京セラ)、野津拓人(キーサイト)、水田和利(日清紡マイクロデバイス)
16:05~16:30	+極からのECM伸長メカニズム考察 伊藤 貞則 (イトケン事務所)
16:30~16:55	LSIプロセス診断の微細プロセスデバイス適用 ○大谷直己、根本規生、河原宏昭、新藤浩之、鈴木浩一 (宇宙航空研究開発機構) 柳生瑛子、矢部一博、立山博丈、村上功、谷田川裕生、浅井憲二、高森圭(沖エンジニアリング株式会社)
16:55~17:20	温度サイクルウィスカ伸長メカニズム考察 伊藤 貞則 (イトケン事務所)
17:20~17:25	閉会挨拶 (日本信頼性学会副会長 木村光宏)